1단계(3차년도) 기술문서

(과제명) 대규모 분산 에너지 저장장치 인프라의 안전한 자율운영 및 성능 평가를 위한 지능형 SW 프레임워크 개발 (과제번호) 2021-0-00077

• 결과물명 : TestBed를 이용한 Test 결과 및 운영보고서

• 작성일자 : 2023년 11월 20일

과학기술정보통신부 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 "1단계(3차년도) 기술문서"로 제출합니다.

수행기관	성명/직위	확인
인셀(주)	전윤창/전임연구원	ENEED OF THE PARTY

정보통신기획평가원장 귀하

목적 및 사용 권한

• Purpose	ESS 발전·운영	사이트 데이터 수	집 연계 프로세스	구축을 위한 통신	<u>-</u> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Date	14-DEC-2022				
• Drafter	Y.C.Jeon	• Developer	Y.J.Jeon	Approver	S.H.Kim

이 자료는 인셀(주)의 소유입니다. 인셀(주)의 명시적 서면 동의없이 사용, 복제, 복사, 공개, 전송, 전체 또는 일부 내용을 사용할 수 없습니다.

This material is proprietary to incell Co., Ltd. It shall not be used, reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the express written consent of incell Co., Ltd

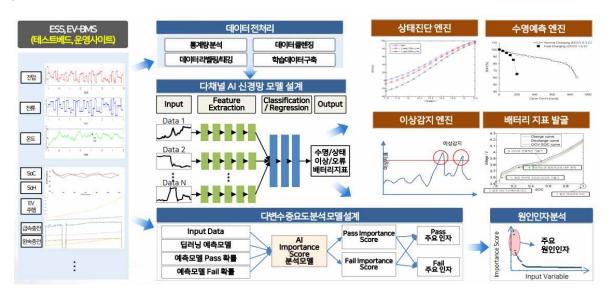
목차

1.	TestBed 개요 및 구성	1
2.	KETI Rack의뢰 시험결과	4
3.	서울대 Module 의뢰 시험결과	6
4.	서울대 Rack 의뢰 시험결과	8
5.	슈어소프트 Rack 의뢰 시험결과	18

1. TestBed 구성

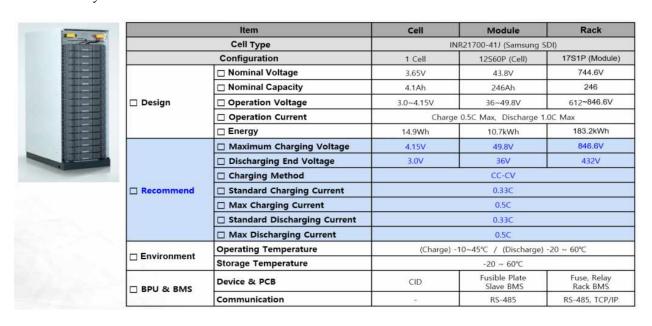
1.1. 목적

- 테스트베드에서의 시험은 안전AI분석엔진 기술개발, 지능형 안전SW 기술 및 검증체계 기술개발의 데이터셋 확보를 목적으로 함.
- 본 시험계획서는 주관연구개발기관인 "KETI"에서 작성한 시험의뢰서의 시험이며, 인셀 테스트베드에서 본 시험을 수행함.



1.2. 시료 정보

- Battery Rack



- Battery Module (모델명: SP44-41-235)



	Item	Cell	Module	
	Cell Type	INR21700-4	11J (Samsung SDI)	
	Configuration	1S1P (Cell)	12S60P (Cell)	
	☐ Nominal Voltage	3.65V	43.8V	
	☐ Nominal Capacity	4.1Ah	246Ah	
□ Design	☐ Operation Voltage	3.0~4.15V	36~49.8V	
<u> </u>	☐ Operation Current	Charge 0.5C Ma	x, Discharge 1.0C Max	
	☐ Energy	14.9Wh	10.7kWh	
	☐ Maximum Charging Voltage	4.05V	48.6V	
	☐ Discharging End Voltage	3.0V	36V	
	☐ Charging Method	cc-cv		
☐ Recommend	☐ Standard Charging Current	0.33C		
	☐ Max Charging Current	0.5C		
	☐ Standard Discharging Current		0.33C	
	☐ Max Discharging Current	0.5C		
	Operating Temperature	(Charge) -10~45°C	/ (Discharge) -20 ~ 60°C	
☐ Environment	Storage Temperature	-20 ~ 60°C		
Lowert a neve	Device & PCB	CID	Fusible Plate, Slave BMS	
☐ BPU & BMS	Communication	18	RS-485	

1.3. 테스트베드 / 시험기기 정보



ESS TEST BED

- 위치: 인셀 (1층 실험실)

- 구축: 2021.11

- 구성

· Battery Rack System (612~846.6Vdc, 235Ah)

· DCP (BAT-PCS-Grid 간 CB, 각 장비 전원 CB)

· PCS (100kW)

· PC (HMI)

PCS(Power Conversion System)



- 모델: SAVEEN100GT(데스틴 파워)

- 사양: 100kW

- AC 출력 계통 전압: 3*380Vac

- DC 연계전압: 570~1000Vdc

- 전용 프로그램을 통한 설정 및 PCS 운전

BATTERY PACK TESTER



- 모델: PSC100-100 (PNE SOLUTION)
- 사양: 10kW
- AC Input: 380V(3상 4선)
- DC Voltage: 5V(min), 100V(max)
- DC Current: 100A(max) /1-ch
 - · 총 4-ch 구성, 병렬운전 가능 (400A/4-ch)
- 전용 PC/프로그램을 통한 운전설정 및 데이터 저장
 - · 스케쥴 설정기능_자동운전/정지
 - · 챔버정보 연동
 - · 데이터 출력 (시간, 전압, 전류, 용량, 자동 그래프 등)

항온항습기



- 모델: TH-G-1500
- Size: (W)1100 x (D)1000 x (H)1450 [mm]
- 온도설정: -40 ~ 150℃ (최대범위)
 - -20 ~ 60℃ (검교정 획득 범위)
- 습도설정: 25 ~ 95 (%RH)
- 설정 프로그램 지원
 - · 충/방전 기기와 정보연동, 셋팅 별도

데이터로거(모듈 확장형 데이터 수집장비)



- 모델: GL7000 (GRAPHTEC)
- 최대 10 앰프모듈 부착
- 전용프로그램을 사용하여 다채널 측정(max 112-ch)
 - · 본체 설정 동작 & PC 소프트웨어 동작
- 저전압(1mV~100V), 고전압(1000V) 센서 모듈
- 온도 센서 연계 모듈
- 전류 측정 시 Shunt(션트) 저항 적용 데이터 확보

2. KETI 의뢰 시험결과

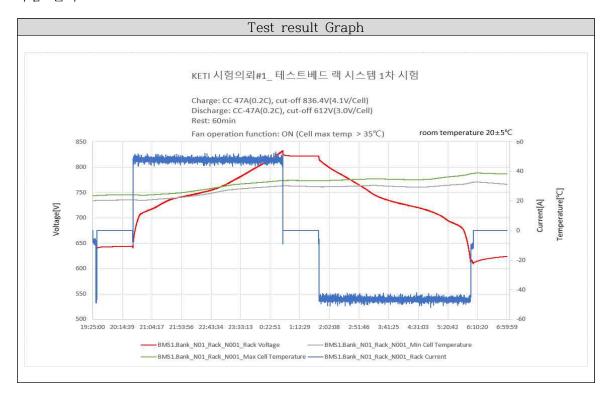
(1) 시험 No: 1회

- 시험수행 일자: 2022년 3월 30일

- 시험 조건

주변 온도	Fan 동작	충전	휴지	방전	Cycle
25℃	해제	836.4V (4.1V/Cell) CC 47A (0.2C) cut-off 836.4V	1시간	612V (3.0V/Cell) CC -47A (0.2C) cut-off 612V	1회

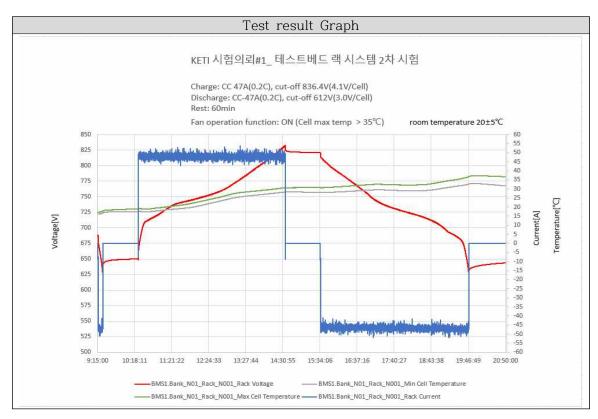
- 시험 결과





- (1) 시험 No: 2회
- 시험수행 일자: 2022년 4월 6일
- 시험 조건

주변 온도	Fan 동작	충전	휴지	방전	Cycle
		836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
25℃	동작	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -47A (0.2C)	1회
		cut-off 836.4V		cut-off 612V	





3. 서울대 Module 의뢰 시험결과

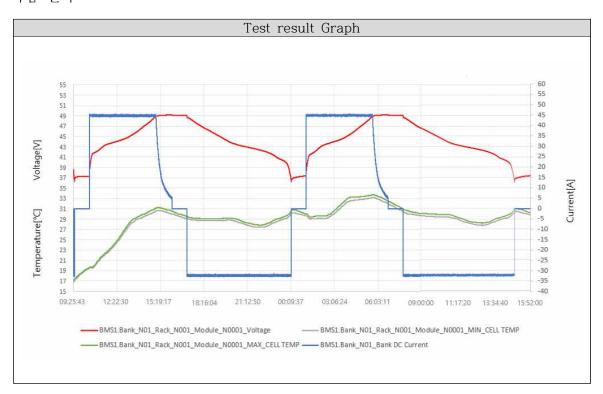
(1) 시험 No: 1

- 시험수행 일자: 2022년 4월 6일

- 시험 조건

챔버 설정 온도	충전	휴지	방전	Cycle
25℃	49.2V (4.1V/Cell) CC 47A (0.2C)	1시간	36.0V (3.0V/Cell) CC -32.25A(0.15C)	2회
	cut-off 49.2V		cut-off 36.0V	

- 시험 결과



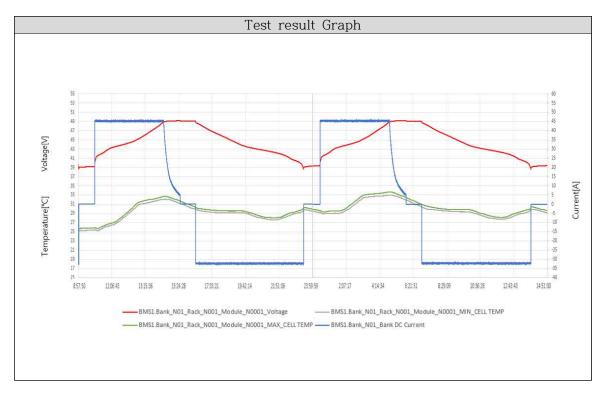
- 시험 사진



(1) 시험 No: 2회

- 시험수행 일자: 2022년 4월 15일

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(기취 기자 저	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
기록)	cut-off 836.4V		cut-off 612V	





4. 서울대 Rack 의뢰 시험결과

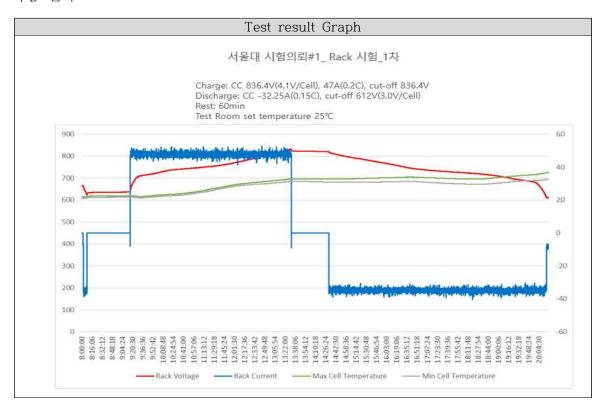
(1) 시험 No: 1

- 시험수행 일자: 2022년 5월 17일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(1) 5] 1) 7} 7]	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
기록)	cut-off 836.4V		cut-off 612V	

- 시험 결과



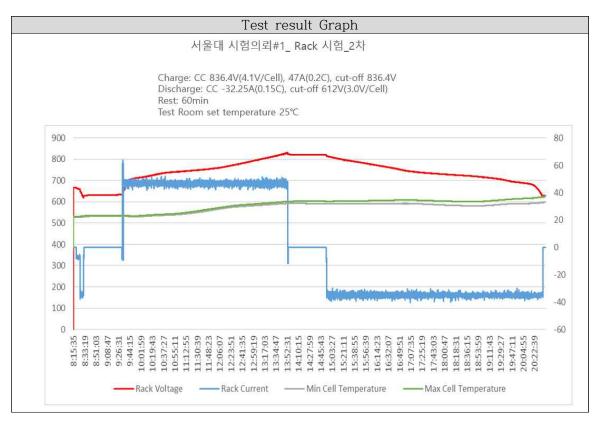
- 시험 사진



(1) 시험 No: 2

- 시험수행 일자: 2022년 5월 24일
- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(기취 기자 저	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
기록)	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



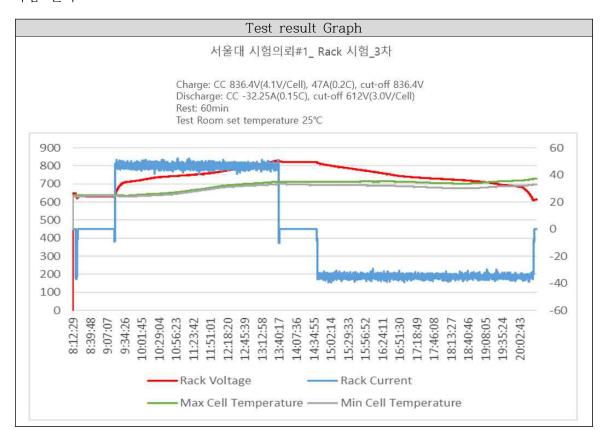
- 시험 사진



(1) 시험 No: 3

- 시험수행 일자: 2022년 6월 29일
- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(기취 기자 저	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
기록)	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



- 시험 사진

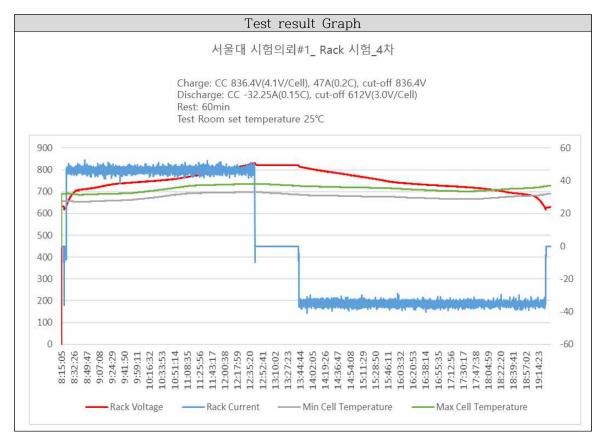


(1) 시험 No: 4

- 시험수행 일자: 2022년 6월 30일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(기취 기자 저	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
기록) 	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



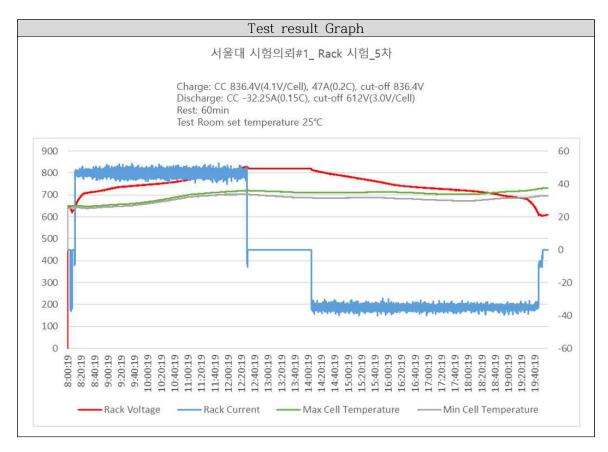


(1) 시험 No: 5

- 시험수행 일자: 2022년 7월 4일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	

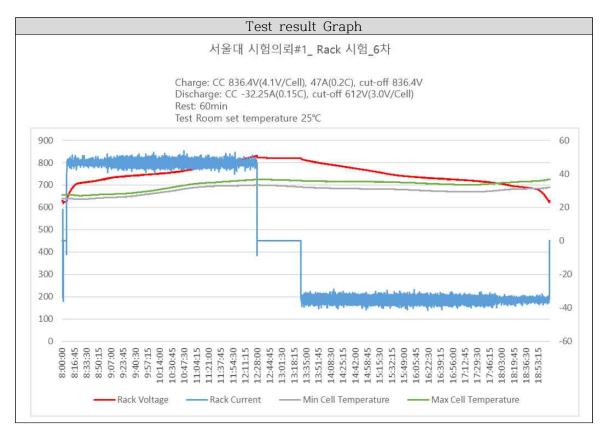




(1) 시험 No: 6

- 시험수행 일자: 2022년 7월 6일
- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
기록)	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



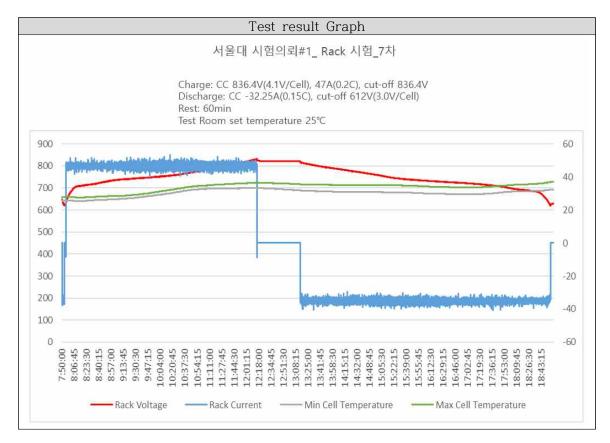


(1) 시험 No: 7

- 시험수행 일자: 2022년 7월 8일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



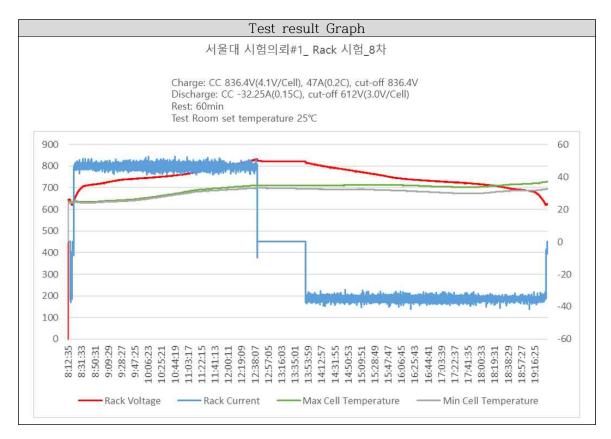


(1) 시험 No: 8

- 시험수행 일자: 2022년 7월 25일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



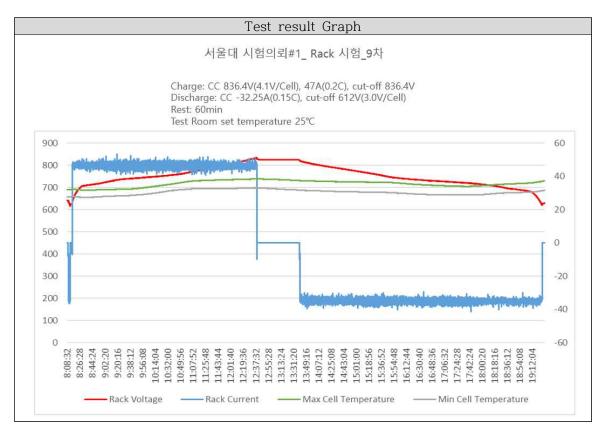


(1) 시험 No: 9

- 시험수행 일자: 2022년 7월 26일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



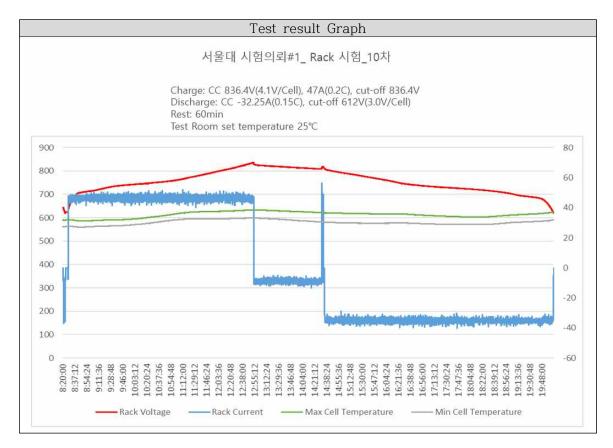


(1) 시험 No: 10

- 시험수행 일자: 2022년 7월 27일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	





5. 슈어소프트 Rack 의뢰 시험결과

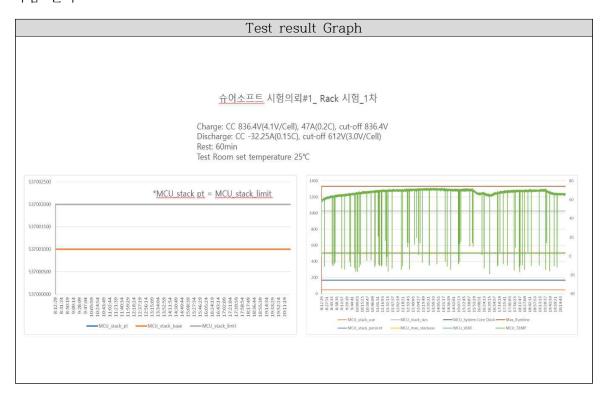
(1) 시험 No: 1회

- 시험수행 일자: 2022년 6월 29일

- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	

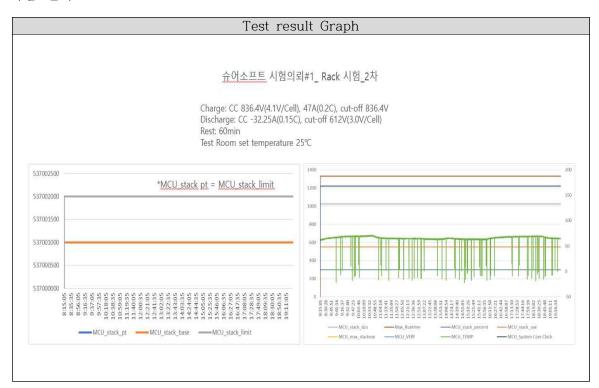
- 시험 결과





- (1) 시험 No: 2회
 - 시험수행 일자: 2022년 6월 30일
 - 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(गोली गोरी स्वे	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전 기록)	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



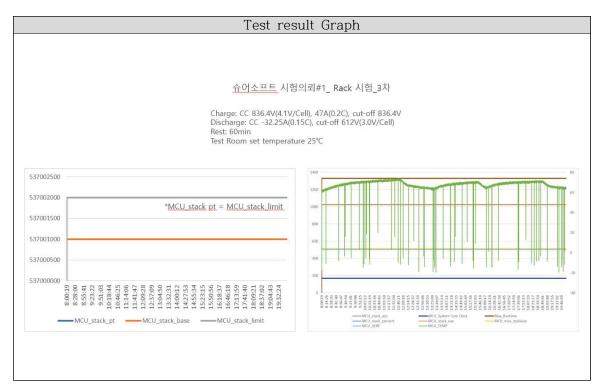
- 시험 사진



(1) 시험 No: 3회

- 시험수행 일자: 2022년 7월 4일

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



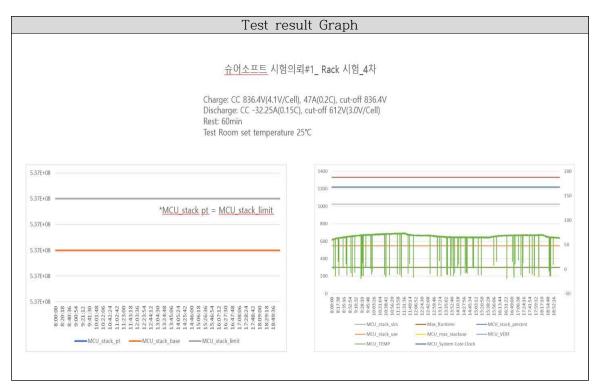
- 시험 사진



(1) 시험 No: 4회

- 시험수행 일자: 2022년 7월 6일

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(गोली गोरी स्वे	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전 기록)	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



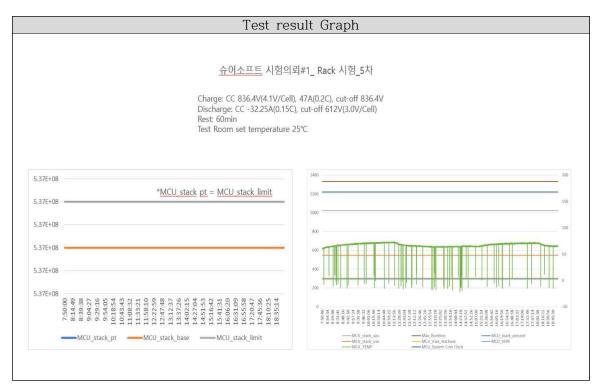
- 시험 사진



(1) 시험 No: 5회

- 시험수행 일자: 2022년 7월 8일

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(기취 기자 저	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
(시험 시작 전 기록)	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



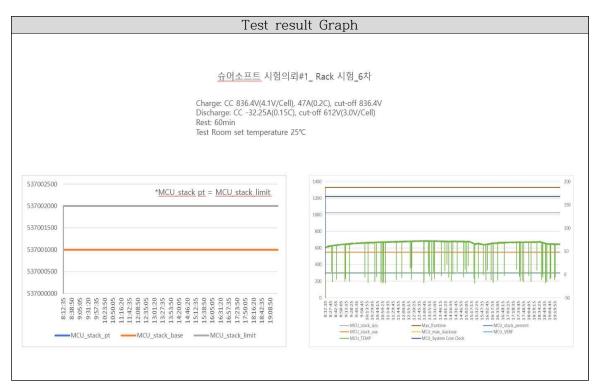
- 시험 사진



(1) 시험 No: 6회

- 시험수행 일자: 2022년 7월 25일

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



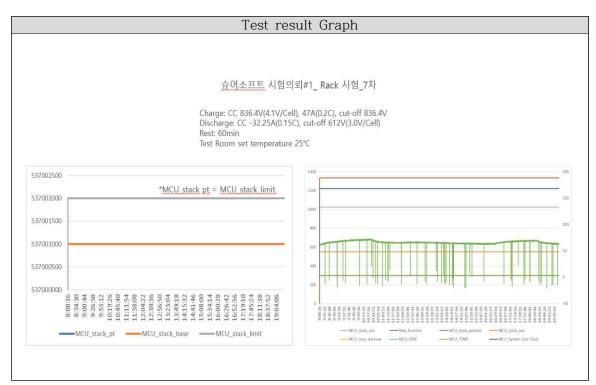
- 시험 사진



(1) 시험 No: 7회

- 시험수행 일자: 2022년 7월 26일

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	



- 시험 사진



(1) 시험 No: 8회

- 시험수행 일자: 2022년 7월 27일
- 시험 조건

주변 온도	충전	휴지	방전	Cycle
(시험 시작 전 기록)	836.4V (4.1V/Cell)		612V (3.0V/Cell)	
	CC 47A (0.2C)	1시간	CC -35.25A (0.15C)	1회
	cut-off 836.4V		cut-off 612V	

